

Перенос водорода в сборке из ниобиевых фольг при воздействии высокотемпературной водородной плазмы на установке “Плазменный фокус”	
<i>А. Ю. Дидык, Р. Вишневецки, В. С. Куликаускас, В. Я. Никулин, А. Н. Майоров</i>	5
Численное исследование тепловых процессов, возникающих в материалах при облучении тяжелыми ионами высоких энергий	
<i>И. В. Амирханов, А. С. Халил, И. Сархадов</i>	10
Релаксационные и термодинамические параметры теории спин-волнового затухания в низкоразмерных магнетиках	
<i>А. К. Нухов, Г. М. Мусаев, З. З. Алисултанов, Х. К. Фадель</i>	19
Электронно-микроскопическое исследование распределения легирующего металла (Ta) в пленках кремнийуглеродных нанокмозитов	
<i>М. Ю. Пресняков, А. И. Попов, Н. Д. Васильева, М. Л. Шупегин</i>	24
Идентификационный анализ дисперсных выделений и пористости в ионно-облученных материалах	
<i>В. И. Псарев, Л. А. Пархоменко</i>	29
Исследование вольт-амперных характеристик леггмюровских пленок жидких кристаллов в области сегнетоэлектрического фазового перехода	
<i>Н. Л. Левшин, П. А. Форш, С. В. Хлыбов, С. Г. Юдин</i>	34
Особенности напыления пленок TiN вакуумно-дуговым методом	
<i>А. З. Хамдохов, Р. Ш. Тешев, З. М. Хамдохов, В. С. Куликаускас, П. Н. Черных</i>	37
К вопросу об эмиссии электронов в катодном пятне вакуумного дугового разряда	
<i>В. Н. Арустамов, Х. Б. Ашуров, Х. Х. Кадыров, И. Х. Худайкулов</i>	40
Особенности изменения спектров диффузного отражения при облучении модифицированных порошков диоксида титана	
<i>М. М. Михайлов</i>	45
Влияние реакторного излучения на микротвердость конструкционных материалов САВ-1 и АМГ-2	
<i>С. А. Байтелесов, Ф. Р. Кунгуров, Д. П. Таджикибаев, Э. Т. Рахимов, Ш. А. Аликулов</i>	53
Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. Точное решение задачи с внутренними источниками	
<i>В. П. Афанасьев, Д. А. Иванов, П. С. Капля, А. В. Лубенченко</i>	57
Закон Малюса для рентгеновского излучения	
<i>А. Н. Волобуев, А. П. Толстоногов</i>	63
Физико-математическая модель поверхностной сегрегации в бинарных сплавах переходных металлов	
<i>А. В. Матвеев</i>	75

Интерферограмма дифракционного излучения, получаемая при прохождении электронного пучка через щелевую мишень

Д. А. Шкитов, Г. А. Науменко, М. В. Шевелёв, А. П. Потылицын, Н. Deng, X. Wang

86

Компьютерное изучение спектральных характеристик и структуры наночастиц $(\text{GaN})_{54}(\text{SiO}_2)_{50}$

А. Е. Галашев

90

Проблемы применения атомно-силовых микроскопов для изучения шероховатости поверхности элементов для изображающей оптики

М. М. Барышева, Б. А. Грибков, М. В. Зорина, Н. Н. Салащенко, Н. И. Чхало

100

Разрешение растрового электронного микроскопа. 2. Измерение разрешения с помощью структур с прямоугольным профилем рельефа

Ю. А. Новиков

105